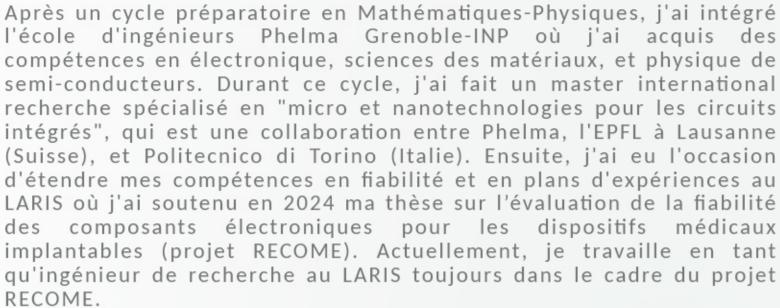




Évaluation et qualification de la fiabilité des composants et des procédés d'assemblages électroniques pour applications médicales

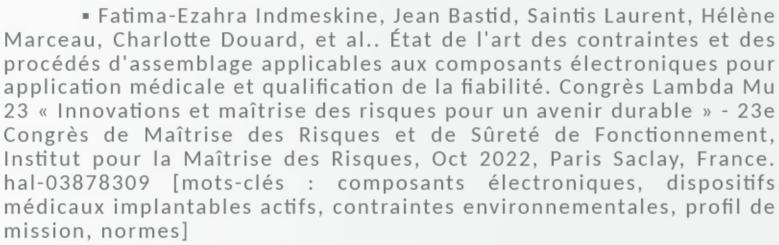
Parcours



Résumé

Projet RECOME: Dans le cadre du projet régional RECOME (Reliability of Electronic COmponents for MEdical devices), l'objet de ce travail de recherche est de définir une méthodologie permettant de qualifier un composant électronique pour respecter un niveau de sécurité des dispositifs médicaux. Il s'agira de définir les tests à réaliser en fonction du type de composants et de l'application médicale.

Conférences



■ F.-E. Indmeskine, L. Saintis, A. Kobi, and M. Barreau, 'Predictive Reliability Modelling Based On Combination Of DoE And ALT', presented at the European Safety and Reliability Conference, Cracow, Poland, 2024.[mots-clés : condensateurs céramiques multi-couches CMS, fiabilité prévisionnelle, plan d'expériences, essais de durée de vie accélérés, plan produit]

• F.-E. Indmeskine, L. Saintis, A. Kobi, and H. Marceau, 'Design-of-Experiments and ALT plan for reliability qualification of chip resistors based on mission profile of AIMDs', presented at the 35th European Symposium on Reliability of Electron Devices, Failure Physics and Analysis, Parma, Italy, 2024. [mots-clés: chips résistifs, dispositifs médicaux implantables actifs, essais accélérés, FMMEA, plan produit]

Indmeskine, Fatima-Ezahra, Laurent Saintis, Abdessamad Kobi, et Hélène Marceau. « Plan d'expérience produit à partir d'essais accélérés pour la qualification de la fiabilité des résistances CMS pour les DMIAs » - 24e Congrès de Maîtrise Des Risques et de Sûreté de Fonctionnement, Institut Pour La Maîtrise Des Risques, 2024. [mots-clés : chips résistifs, dispositifs médicaux implantables actifs, essais accélérés, FMMEA, plan produit]

■ Gaëtan Pelloquin, Thibault Montigaud, Laurent Saintis, and Fatima-Ezahra Indmeskine. Distribution des modes de panne et profils de vie FIDES. In Congrès Lambda Mu 24 « Innovations et Maîtrise Des Risques Pour Un Avenir Durable » - 24e Congrès de Maîtrise Des Risques et de Sûreté de Fonctionnement, Institut Pour La Maîtrise Des Risques, 2024. [mots-clés: FIDES, FMMEA, AdD, FMD, PoF]

Revues

Indmeskine, Fatima-Ezahra, Laurent Saintis, et Abdessamad Kobi. « Review on Accelerated Life Testing Plan to Develop Predictive Reliability Models for Electronic Components Based on Design-of-Experiments ». Quality and Reliability Engineering International

39, n° 6 (2023): 2594-2607.https://doi.org/10.1002/qre.3330. [mots-clés : composants électroniques, essais de durée de vie accélérés, FMMEA, plans d'expériences, guide de fiabilité prévisionnelle]

Chapitre de livre

■ Kobi, Abdessamad, Fatima-Ezahra Indmeskine, and Laurent Saintis. "Life testing plan for electronic components based on design of experiments." Developments in Reliability Engineering. Elsevier, 2024. 661-685. [mots-clés: composants électroniques, essais de durée de vie accélérés, FMMEA, plans d'expériences, guide de fiabilité prévisionnelle]







